

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATOS PERSONALES**

Nombre y Apellidos	Claudia Jazmín Ramos Torres
Teléfonos de contacto:	(044) 55-16032285
E-mail:	<a href="mailto:NICKY5898@hotmail.com">NICKY5898@hotmail.com</a> <a href="mailto:cramos@ipn.mx">cramos@ipn.mx</a>

### **FORMACIÓN ACADÉMICA**

#### **Educación Superior:**

(1998-2002) Licenciatura en Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Químicas, U. A. de C. Saltillo, Coahuila.

#### **Postgrado:**

(2002-2004) Maestría en Ciencia y Tecnología Cerámica, Facultad de Ciencias Químicas, U. A. de C. Saltillo, Coahuila

### **EXPERIENCIA LABORAL**

2004- 2006

Laboratorio de Análisis Ambientales e Insumos S.A de C.V realizando:

- Desarrollo e investigación de nuevos productos.
- Realización de medios de cultivos para microorganismos benéficos empleados para diversos problemas presentes en el medio ambiente.
- Uso del equipo de campo Petroflag para la determinación de compuestos aromáticos presentes en el suelo por contaminación de petróleo, gasolina, diesel, etc.

- Biolixiviación y lixiviación química de minerales.
- Determinación de cobre en un mineral por volumetría.

2010...

Especialista del laboratorio de elipsometría.

- Caracterización de películas gruesas, delgadas y ultradelgadas de diversos materiales y para diversos campos de aplicación que van desde los semiconductores hasta los biológicos, usando un elipsómetro espectroscópico UVISLTM marca HORIBA JOBIN YVON.
- Inventarios y administración del laboratorio.

## **CONGRESOS**

*“Influence of thin films nature in the accurate measurements throughout different characterization techniques: A comparative AFM, SEM, Elipsometry and HR-DRX.”*

**Autores:** A. Rodríguez-Pulido, H. Martínez Gutiérrez, J. V. Méndez Méndez, J. Andraca Adame, I. Arzate Vázquez, M. De J. Perea Flores, A. Martínez Rivas, L. A. Moreno Ruiz, C. J. Ramos Torres.

**Congreso:** 8th international topical meeting on nanostructured materials and nanotechnology (NANOTECH 2011), Tuxtla Gutiérrez, México.

*“Reliability of thin solid film thickness measurements performed using optics and microscopy characterization”*

**Autores:** J.V. Méndez Méndez, C.J. Ramos Torres, J.A. Andraca Adame, H. Martínez Gutiérrez, L.A. Moreno Ruiz, A. Rodríguez Pulido.

**Congreso:** The Advanced Electron Microscopy and Nanospectroscopy Symposium at the XX International Materials Research Congress held in Cancun, México Agosto 14 al 19 2011.

*“Thickness determination in multi – layer films”*

**Autores:** Claudia Jazmín Ramos Torres, José Alberto Andraca Adame, Luis Alberto Moreno Ruiz, Juan Vicente Méndez Méndez, Hugo Martínez Gutiérrez.

**Congreso:** "IV International Conference on Surfaces, Materials and Vacuum" en México en la ciudad de Puerto Vallarta en el mes de Septiembre del 26 al 30 del 2011.

*"Structural properties of  $Zn_xCd_{1-x}$  buffer layers on GaAs"*

**Autores:** José Alberto Andraca Adame, Claudia Jazmín Ramos Torres, Juan Vicente Méndez Méndez, Hugo Martínez Gutiérrez, Alicia Rodríguez Pulido, Tetyana Kryshab.

**Congreso:** "IV International Conference on Surfaces, Materials and Vacuum" en México en la ciudad de Puerto Vallarta en el mes de Septiembre del 26 al 30 del 2011.

*"Synthesis of poly (methyl methacrylate-co-hitenol bc-10) by heterogeneous copolymerization to be used as a positive resist"*

**Autores:** V.M. Ovando-Medina, P.S. Piña-García, M.A. Corona-Rivera, T.E. Lara-Ceniceros, H. Martínez-Gutiérrez and C.J. Ramos-Torres

**Congreso:** "International Conference on Polymers and Advanced Materials" POLYMAT-2011.

## **CURSOS**

Curso de Ellipsometry

**Impartido por:** Juan Antonio Zapien.

**Lugar:** "IV International Conference on Surfaces, Materials and Vacuum" en México en la ciudad de Puerto Vallarta en el mes de Septiembre del 26 al 30 del 2011.